ИЕТОД Частотно-Геометрической Фокусировки В диэлектрическом Индукционном Каротаже



АКАДЕМИЯ НАУК СССР Сибирское отделение институт геологии и геофизики

МЕТОД ЧАСТОТНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ИНДУКЦИОННОМ КАРОТАЖЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НОВОСИБИРСК-1979

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены теоретические основы метода частотногеометрической фокусировки (ЧТФ), позволяющего ослабить искажающее влияние токов проводимости на результаты измерений в диэлектрическом каротаже и повысить разрешающую способность методов ДИК по отношению к диэлектрической проницемости пластов. Исследованы радиальные и вертикальные характеристики фокусирующих зондов ЧТФ, показана целесообразность использования установок с частотно-геометрической фокусировкой для изучения диэлектрической проницаемости пластов с пониженным удельным сопротивлением.

Составители

Ю.Н.Антонов, Л.А.Табаровский, И.М.Панич

Печатается по решению секции геофизики Ученого совета Института геологии и геофизики СО АН СССР С Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1979г.

Подписано к печати 15.Х.1979 г. МН 03106. Бумага 60×84/16. Печ.л.3,0. Уч.-изд.л. 2,7. Тираж 190. Заказ 344. Цена 40 коп.

Институт геологии и геофизики СО АН СССР Новосибирск, 90. Ротапринт.

Диэлектрическая проницаемость горных пород в значительной мере определяется их коллекторскими свойствами, степеныв насыщенности фицидами, вещественным составом и фазовым состоянием насыщающей компоненти. Поэтому данные о диэлектрической проницаемости полод, заполняющих околоскважинное пространство, играют важную роль в промысловой геофизике при выявлении нефтегазонасыщенных коллекторов и определении их продуктивности.

Измерение диэлектрической проницаемости в скважинах осуществляется методами диалектрического индукционного каротажа (ДИК). Все методы ДИК основаны на измерении характеристик магнитного поля соосного скважине магнитного диполя и различаются между собой по одному или нескольким из следущих признаков:

I. Вид регистрируемых характеристик магнитного поля (амплитуды, фазы и различные функции этих величин);

2. Количество регистрируемых характеристик поля и, как следствие, число генераторных и измерительных алементов, входящих в состав зондирущиего устройства;

3. Применяемый метод фокусировки.

В совокупности условий, обеспечивалица фокусировку, важнейшим фактором, общам практически для всех фокусирущих систем, является одинаковая зависимость величин, регистрируемых отдельными элементами установки, от параметров исключаемой помехи. При этом, если вклад помехи в сигнал аддитивен, то измеряют разностные величины, если искажающее влияние имеет мультипликативный характер, то измеряют относительные величины. Известно, что при определенных условиях (высокая частота, большая длина зонда) вертикальная компонента поля \mathcal{H}_Z вертикального магнитного диполя в скважине, пересекающей пласт неограниченной мощности, может быть представлена в виде / 1/:

$$H_{Z} = H_{Z}^{o}(k_{n}L) / I_{0}^{2}(k_{c}a), \qquad (B.I)$$

где H_2^{o} – вертикальная компонента поля вертикального магнитного диполя в однородной среде с параметрами пласта; $g_c^{e} = -\omega^2 \varepsilon_c \, g - i \, \tau_c \, f^{\omega} ;$

$$k_n^2 = -\omega^2 \varepsilon_n \mathcal{H} - i \tilde{\sigma_n} \mathcal{N}\omega ;$$

- ω круговая частота поля;
- магнитная проницаемость среды;
- *Е* с − диэлектрическая проницаемость скважины;
- Еп диалектрическая проницаемость пласта;
- *€с* проводимость скважины;
- *𝒏* − проводимость пласта;
- а радиус скважины;
- длина зонда (расстояние от генераторного диполя до точки измерения поля);
- I₀ молифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Очевидно, величину H_Z , определяемую соотношением (B.I), можно представить в виде:

$$H_{Z} = \left| H_{Z}^{o}(\pounds_{n} L) \right| e^{i(\mathscr{G}_{L} - \mathscr{G}_{a})} / \left| I_{o}^{2}(\pounds_{c} a) \right|, \qquad (B.2)$$

где

$$\mathcal{P}_{L} = Arq\left(H_{Z}^{0}(k_{n}L)\right); \quad \mathcal{Y}_{a} = Arq\left(I_{0}^{2}(k_{c}a)\right).$$

Фаза \mathscr{G}_{L} не зависит от электрических и геометрических параметров скважины и совпадает с фазой поля двухалементного зонда в однородной среде с параметрами пласта \mathscr{E}_{n} и \mathscr{O}_{n} . Функция определяется параметрами скважины и не зависит от длины зонда. Как следует из (B.2), величина \mathscr{G}_{Ω} при измерении фазы поля является аддитивной помехой. Очевидно, что разность фаз $\mathscr{O}\mathscr{G}$, измеренная двумя зондами различной длины:

$$d\mathcal{G} = Hrq(H_2(L_2)) - Arq(H_2(L_1)) = \mathcal{G}(L_2) - \mathcal{G}(L_1),$$

зависит только от параметров пласта и легко может быть проинтерпретирована.

При измерении модуля поля помеха, связанная с искалацици влиянием скважины, является согласно (В.2), мультипликативной. Поэтому при регистрации отношения амплитуд, измеренных зондами различной длины, измеряемая величина не зависит от параметров скважины.

Наряду с геологическими помехами в виде скважины и зоны

проникновения, которые различными приемами фокусировки удается в той или иной мере исключить, во всех известных способах лиалектрического каротажа присутствует помеха физического харак-TEDA. KOTODAR USBECTHEMM IDMEMAMM ČOKYCHOOBKA HE YCTDAHRETCR M елинственным известным в настоящее время способом преодоления которой является повышение частот. Такой помехой являются TORM проволимости. Отметим. что возможность повышения частоты ограничивается двумя обстоятельствами. Во-первых, использование TDESMEDHO BHCOKEX TACTOT IDEBOILT B CELTY CRAH-BODERTA K CHILHOму затухание полей. Во-вторых, на частотах порядка IOO МГи возникают трулности в технической реализации способов INAJERTDNческого каротажа. В частности. становятся практически неприемлемыми индукционные датчики магнитного поля, выполненные в виде KATVIER.

Целью настоящей работы является изложение метода частотногеометрической фокусировки (ЧГФ), позволяющего существенно ослабить искажающее влияние токов проводимости в индукционном диэлектрическом каротаже и тем самым расширить (прежде всего, в область низкоомных разрезов) класс геозлектрических условий, в которых возможно определение диалектрической проницаемости горных пород методами скважинной электрометрии.

§ I. Устранение искаланцего влияния токов проводимости в индукционном диалектрическом каротаже (частотно-геометрическая фокусировка)

Рассмотрим выражение для поля магнитного диполя с моментом М в однородной среде:

$$H_{Z} = (M/2\pi L^{3})e^{-kL}(1+kL)$$
(I.I)

ЕСЛИ Обозначить через // реальную часть, а через // мнимую часть выражения $\pounds L$, то

$$h_{2} = e^{-kL}(1+kL) = e^{-m} \left\{ \left[(1+m)\cos n + n\sin n \right] + i \left[n\cos n - (1+m)\sin n \right] \right\}$$
(I.2)

Вырадения для /// и // через обобщенные параметры

$$P = \sqrt{\omega_{R} \varepsilon/2} L \qquad (I.3)$$

$$V = \omega^{2} \kappa \varepsilon L^{2}/2$$

имеют следущий вид:

$$m = \sqrt{p^4 + y^2} - y^2; \qquad n = -\sqrt{p^4 + y^2} + y^2. \quad (I.4)$$

Рассмотрим первые два члена ряда Тейлора для h_z как функцив от V:

$$h_{z}(P, v) \approx h_{z}(P, 0) + v \frac{\partial}{\partial v} h_{z}(P, 0)$$
(I.5)

Tak kar

$$\frac{\partial}{\partial v} h_2 = -e^{-kL} (1 + kL) \frac{\partial}{\partial v} (kL) + e^{-kL} \frac{\partial}{\partial v} (kL) =$$

$$= -e^{-kL} \frac{\partial}{\partial v} (\frac{k^2 L^2}{2}) = -e^{-kL} ,$$
(I.6)

то

$$h_{z}(P, V) \approx \tilde{h}_{z}(P) + V e^{-P(1-\tilde{L})}$$
 (I.7)

Здесъ

$$\tilde{h}_{z}(P) = e^{-P} \left\{ \left[(1+P) \cos P + P \sin P \right] + i \left[-P \cos P + (1+P) \sin P \right] \right\}$$
(I.8)

При условии

$$V = \omega \varepsilon / \delta \ll 1 \tag{T.9}$$

величину \tilde{h}_x можно понимать как часть магнитного поля, порождаемую токами проводимости, а второе слагаемое в правой части (I.7) – как часть магнитного поля, обусловленную токами смещения. Относительный вклад токов смещения по сравнению с токами проводямости в суммарное магнитное поле определяется соотношеHHEM:

$$\partial a = \left| \frac{\gamma e^{-\rho(r-t)}}{\tilde{h}_{2}(\rho)} \right| = \frac{\gamma}{\sqrt{(1+\rho)^{2} + \rho^{2}}}$$
(I.10)

Из (I.IO) следует, что при малых значениях безразмерного параметра & (низкие частоты, небольшие значения диалектрической проницаемости, невысокие удельные сопротивления пород) чувствительность известных способов диалектрического каротажа к исследуемой характеристике среды становится слабой.

С целью уменьшения влияния токов проводимости на измеряемые характеристики поля, рассмотрим два двухэлементных зонда разной длини L_1 и L_2 , в которых генераторные диполи с моментами $M_{\rm I}$ и M_2 питаются токами различных частот ω_1 и ω_2 . Предполоким, что параметры среды и установки удовлетворяют условиям (I.9). Из (I.I), (I.7) для каждого из зондов получаем:

$$H_{Z}(\omega_{1},L_{1}) = \frac{M_{1}}{2\tilde{\kappa}L_{1}^{3}} \left[\tilde{H}_{Z}(\rho_{1}) + v_{1}e^{-\rho_{1}(1-i)} \right], \qquad (I.II)$$

$$H_{Z}(\omega_{2,L_{2}}) = \frac{M_{2}}{2\pi L_{2}^{3}} \left[\tilde{h}_{Z}(\rho_{2}) + \gamma_{2} e^{-\rho_{2}(1-i)} \right], \qquad (I.I2)$$

где

J = 1.2

$$P_{j} = \sqrt{\omega_{j} \rho v_{j}/2} L_{j}$$
(I.I3)

$$\gamma_j = \omega_j^2 \mathcal{E} \mathcal{M} L_j^2 / 2 \tag{I.14}$$

Подчиним моменти, частоти и длини условиям:

$$M_2/M_1 = (L_2/L_1)^3$$
 (I.I5)

$$\omega_1/\omega_2 = (L_2/L_1)^2 \tag{I.16}$$

Если при условиях (I.I5), (I.I6) определить разность характеристик поля, измеряемых каждым зондом (например, разность амплитуд, фаз или любых других одинаковых функций поля), то эта разность будет пропорциональна величине ($V_7 - V_2$), а, следовательно, и диэлектрической проницаемости среды \mathcal{E} . Действительно, при собладении условий (I.I5), (I.I6) выполняются соотношения

$$P_1 = P_2; \quad M_1/(2\pi L_1^3) = M_2/(2\pi L_2^3); \quad V_1 \neq V_2,$$

означащие, что в точках расположения измерительных элементов каждого зонда вклады токов проводимости в суммарное магнитное поле одинаковы, а вклады токов смещения различаются между собой. Поэтому при образовании разности любых одинаковых функций полей $H_2(\omega_1, L_1)$ и $H_2(\omega_2, L_2)$ слагаемые, связанные с магнитным полем токов проводимости, будут взаимно уничтожаться, что легко доказывается в каждом конкретном случае соответствующим разложением рассматриваемых функций в ряды Тейлора по параметрам y_1 и y_2 . Например, рассмотрим случай, когда измеряется разность амплитуд

$$\partial H = |H_{z}(\omega_{1},L_{1})| - |H_{z}(\omega_{2},L_{2})|$$
(I.17)

Очевидно,

$$|H_{Z}(\omega_{j},L_{j})| = \sqrt{|U_{j}|^{2} + |V_{j}|^{2} - 2|U_{j}||V_{j}|\cos(9_{U_{j}} - 9_{U_{j}})}, \quad (I.18)$$

где

$$U_{j} = (M_{j}/(2\pi L_{j}^{3}))\widetilde{h}_{z}(P_{j})$$
(I.19)

$$\mathcal{V}_{j} = (M_{j} / (2 \pi L_{j}^{3})) \, V_{j} e^{-P_{j} (1-i)} \tag{I.20}$$

$$\mathcal{G}_{Uj} = \mathcal{A}_{Pq} U_j \tag{1.21}$$

$$\mathcal{G}_{\mathcal{V}_i} = Arq \mathcal{V}_i$$

(1.22)

Из условий (І.І5), (І.І6) следует:

$$|\mathcal{U}_1| = |\mathcal{U}_2|; \quad \mathcal{G}_{\mathcal{U}_1} = \mathcal{G}_{\mathcal{U}_2}; \quad \mathcal{G}_{\mathcal{U}_1} = \mathcal{G}_{\mathcal{V}_2}.$$

Подагая $|U_j| \neq 0$, $\mathcal{G}_{U_j} - \mathcal{G}_{U_j} \neq \mathcal{F}/2$ и опуская индекси в обозначениях U_j , \mathcal{G}_{U_j} , \mathcal{G}_{U_j} , ρ_j , получим из (I.I8) с точ-ностью до членов первого порядка малости:

$$|H_{\mathbb{Z}}(\omega_{j},L_{j})| = |U|(1-(|\mathcal{V}_{j}|/|U|)\cos(\mathcal{Y}_{U}-\mathcal{Y}_{\mathcal{Y}})) = \frac{8}{8}$$

$$= |U| + |\mathcal{V}_j| \cos(\mathcal{Y}_U - \mathcal{Y}_{jr}).$$

Отсюда

$$\partial H = \frac{M_1}{2\pi L_1^3} e^{-\rho} (v_1 - v_2) \cos(y_1 - y_2)$$
(I.23)

Из соотношения (I.23) следует, что разность модулей пропорциональна величине ($V_1 - V_2$). Аналогичное утверждение можно доказать при измерении любых других функций поля H_2 .

Рассмотрим как осуществляется фокусировка магнитного поля токов проволимости в случае использования многовлементных зондов. Будем рассматривать линейные зонды. т.е. такие системы. в состав которых при наличии нескольких измерительных алементов входит только опин генераторный диполь. либо при наличии нескольких генераторов входит только один измерительный датчик. Для определенности положим, что зонд содержит один измерительный элемент и // генераторов с моментами Мт,..., М // . Будем обозначать такой зонд через 2. . Очевидно, что в составе зонна 7, имеется m двухалементных зондов, длины которых обозначим через Li', ,..., L''. Круговая частота возбуждающего тока во всех генераторах - и, . В обозначениях измеряемых величин условимся указывать в качестве аргумента наименование зонда (Z_1), отмечая тем самым зависимость этих величин от пара-метров ω_1 , $L_1^{(1)}, \ldots, L_m^{(1)}$, $M_1^{(1)}, \ldots, M_m^{(1)}$. Суммарное магнитное поле в точке измерения можно представить следующим об-DASOM:

$$H_{z}(z_{1}) = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{m} \frac{M_{j}^{(t)}}{(L_{j}^{(t)})^{3}} \left[\widetilde{h}_{z}(P_{j}^{(t)}) + V_{j}^{(t)} e^{-P_{j}^{(t)}(1-L_{j})} \right], \quad (I.24)$$

где

$$\rho_{j}^{(1)} = \sqrt{\omega_{1,N} \sigma/2} L_{j}^{(1)}$$
(I.25)

$$W_{j}^{(1)} = \omega_{1}^{2} \mathcal{E}_{\mathcal{A}}(L_{j}^{(1)})^{2}/2; \quad j = 1, ..., m.$$
 (I.26)

Рассмотрим (m +1) элементный зонд Z2, У которого все

линейные размеры изменены по сравнению с линейными размерами зонда Z₁ в L раз:

$$L_{j}^{(e)}/L_{j}^{(1)} = d; \quad j = 1, ..., m$$

Зонды Z_1 и Z_2 будем называть геометрически подобными, а величину , в соответствии с общепринятой терминологией, будем называть коэфициентом геометрического подобия второго зонда относительно первого. Частоту возбуждающих токов в зонде Z_2 обозначим через ω_2 . В точке расположения измерительного датчика зонда Z_2 магнитное поле определяется равенством:

$$H_{2}(2_{2}) = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{m} \frac{M_{j}^{(2)}}{(L_{j}^{(2)})^{3}} \left[\tilde{h}_{2}(P_{j}^{(2)}) + V_{j}^{(2)} e^{-P_{j}^{(2)}(1-i)}\right]$$
(I.27)

Величины $P_j^{(2)}$, $V_j^{(2)}$ имеют вид, аналогичный (I.25), (I.26). Если положить

$$M_j^{(2)}/M_j^{(1)} = \alpha^3$$
 (I.28)

$$\omega_1/\omega_2 = \alpha^2, \qquad (1.25)$$

то нетрудно показать, что также, как и в случае двухэлементных зондов разность любых двух одинаковых характеристик магнитного поля, измеренных каждым из геометрически подобных зондов с параметрами, удовлетворящими условиям (I.28), (I.29), пропорциональна диэлектрической проницаемости среды.

Характер зависимости измеряемой величины от физических параметров разреза определяет разрешающую способность соответствующего метода по отношению к этим параметрам. Введем количественную меру разрешающей способности (или чувствительности) методов диэлектрического каротажа по отношению к диэлектрической проницаемости среды \mathcal{E} . Пусть при изменении диалектрической проницаемости на величину $\Delta \mathcal{E}$ измеряемая величина \mathcal{F} получает приращение $\Delta \mathcal{F}$. Очевидно, параметр \mathcal{D} , определяемый соотношением

$$\dot{\mathcal{E}} = \frac{\Delta f/f}{\Delta \varepsilon/\varepsilon} , \qquad (I.30)$$

IO

характерирует разрешающую способность метода. При ДЕ-0

$$l \rightarrow \frac{d \ell n \ell}{d \ell n \epsilon}$$
(I.31)

Следовательно, величина 🖉 есть тангенс угла наклона графика

↓ (E). изображенного в билогарифиическом масштабе. На рисунках I-2 приведены значения $\delta^{h} = \delta^{l} H(2\pi L_{1}^{3}/M_{1})$ и $d^{\prime} \mathscr{G} = Arq_{H(2_{1})} - Arq_{H(2_{2})}$ для трехэлементного зонда с коэфінциентом геометрического подобия $\mathcal{L} = \sqrt{2}$. По оси абсцисс отложены значения параметра $V = \omega_1 \mathcal{E} / \mathcal{E}$. Шифр кривых ρ . Из сопоставления с расчетами амплитудно-фазовых характеристик двухалементных зондов ЛИК (рис.3-4) следует. что разностная характеристика поля, построенная по результатам измерений двумя двухэлементными зондами, параметры которых удовлетворяют условиям (I.I5), (I.I6), обладает лучшей разрешенией способностью по отношению к диэлектрической проницаемости средн. Это полтверждается и расчетами чувствительности / амплитудных и фазовых характеристик. представленными на рисунках 5-6. Вся область параметров с практически нулевой чувствительностью у двухалементного зонда (рис.7-8) становится областью со значениямя / не менее единицы для зондов с частотно-геометрической фокусировкой токов проволимости.

Разностные характеристики для пятиэлементных зондов (рис. 9), включающих трехэлементный зонд индукционного диэлектрического каротажа и зонд, геометрически ему подобный с коэффициентом подобия $\mathcal{A} = \sqrt{2}$, представлены на рисунках IO-I2. Здесь

$$\Delta h_1 = dh_1(z_1) - dh_1(z_2)$$

$$\Delta h_{2} = dh_{2}(z_{1}) - dh_{2}(z_{2})$$

$$\Lambda \varphi = d\varphi(z_2) - d\varphi(z_1)$$

$$dh_1(Z_1) = \left| \frac{h_2(L_1) - h_2(L_2)}{h_2(L_1)} \right|_{\omega = \omega_1}$$
II

$$dh_2(z_1) = \left| \frac{h_2(L_1) - h_2(L_2)}{h_2(L_2)} \right|_{\omega = \omega_1}$$

$$\Delta \mathcal{Y}(\mathcal{Z}_1) = \left[\mathcal{Y}(\mathcal{L}_2) - \mathcal{Y}(\mathcal{L}_1) \right]_{\omega} = \omega_1$$

Аналогично через параметры трехэлементного зонда Z_{2} определяются величины $d'h_{1}(Z_{2})$, $d'h_{2}(Z_{2})$, $d'g(Z_{2})$. На рисунках I3-I5 и I6-I8 представлены графики чувствительности соответственно пятиэлементных зондов $\Psi\Phi$ и трехэлементных фокусирующих зондов ДИК.

§ 2. Трехэлементный зонд ЧГФ в однородной среде

Более детальное изучение зондов с частотно-геометрической фокусировкой начнем с изучения влияния коэффициента *L* на величину измеряемого сигнала

$$\sigma h = \left| h_2(\omega_1, L_1) \right| - \left| h_2(\omega_1/\sigma^2, L_1 \cdot \alpha) \right|$$

Как показывают расчеты, изменение 🖌 практически не влияет на форму кривых, отражающих зависимость амплитущных и фазовых xaрактеристик от параметра V . Однако, общий уровень сигнала возрастает с увеличением 🗸 . На рисунке 19 в качестве примера изображены графики зависимости dh от параметра a при фиксированном значения параметра V = I. Пифр кривых - Р. Наисолее резко измеряемая величина возрастает до $\alpha^2 \approx 2$. после чего рост сигнала с увеличением « замедляется. При выборе « , кроме необходимости обеспечить возможно больший уровень сигнала. следует принимать во внимание требование достаточной компактности установки. В этом смысле значение $a^2 = 2$ является вполне приемлемым. Во всех дальнейших расчетах отношение частот в установках ЧТФ полагалось равным 2, а коэффициент геометрического подобия принимался равным, соответственно, / 2. Графики Dasностной амплитуды и разности фаз для $\measuredangle = \sqrt{2}$ приведены на рисунkax I-2.

Рассмотрим зависимость доступных измерению диалазонов удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости однородной среды от конструктивных параметров зонда: частоты и длины установки. Предположим, что минимальный сигнал, доступный гля регистрации с необходимой точностью, составляет 2 единиц ИЗмеряемой характеристики. При амплитушных измерениях эту величину целесообразно выражать в единицах прямого поля, при фазовых - в ралианах. Тогда, в силу монотонной зависимости амилитудных и фазовых характеристик от параметра V , для каждого фиксированного значения *р* можно определить минимальное значение Vmin. начиная с которого измеряемый сигнал имеет уровень не ниже 27. Задавая различные уровни 7, можно получить сеть значений Vmin как функцию от Р. Перейдя от параметров Р и V к ве- $L_1^2 f_M / \rho$ (f_M – частота короткого 42 fm & * личинам И зонда, выраженная в метагерцах), получаем графики, изображенные на рис.20 для разностных амплитуд б и на рис.21 для разности фаз d'9 . Шифр кривых - уровень минимального сигнала, регистрируемого аппаратурой. Эти кривые дают возможность определить при фиксированной длине зонда L, и частоте f, необходимую точность регистрации сигнала в области параметров среды. соответствущей нижним границам диапазонов исследования по лиэлектрической проницаемости є * и удельному сопротивлению Р . Например, для зонда с расстоянием между источником и ближайшей точкой измерения $L_{f} = I$ м на частоте IO МГц в пласте с $\mathcal{E}^{*} = IO$, $\rho =$ IO OM.M:

$$L_{i}^{2} f_{M}^{2} \mathcal{E}^{*} = 1000$$

 $L_{i}^{2} f_{M} / \mathcal{P}^{*} = I.$

Эта точка лежит на рис. 20 между кривыми с шифрами 0,01 и 0,02 и на рис.21 между кривыми с шифрами 0.01 и 0.02. Следовательно.соответствующая аппаратура должна обеспечивать регистрацию с необходимой точностью сигнала величиной 0,0I единиц прямого поля при амплитудных измерениях и 0,01 радиана при фазовых. На частоте 50 МГп в том же пласте имеем:

$$L_{1}^{2} f_{M}^{2} \varepsilon^{*} = 25000,$$

и требования к аппаратуре уже изменяются: 0,03 единиц прямого поля и 0,3 радиана. При этом можно будет определять лиэлектрическую проницаемость пластов с $\xi^* \ge 10$, если их удельное coпротивление не ниже ІО Ом.м. T3

Зафиксируем нижнее значение диапазона изменения удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости средн и будем считать, что $L_1 = I$ м. Тогда точки $\left\{ L_i^2 f_M^2 \, \varepsilon^*, \, L_i^2 f_M / \rho \right\}$ при изменении f_M будут образовывать прямую линию. На рис. 20 и 2I нанесены в качестве примера две такие линии, соответствующие $\rho = 50$ Ом.м, $\varepsilon^* = 20$ (линия I) и $\rho = I0$ Ом.м, $\varepsilon^* = 5$ (линия П). Цифры вдоль линии означают частоту в метагерцах.Анализируя рисунки 20 и 2I можно прийти к следующим выводам:

I. С увеличением частоты требования к чувствительности аппаратуры снижаются. Исключением служит разностная амплитуда $d^{\prime}h$ в средах с $L_{1}^{\prime}f_{M}/f^{\prime}$ 5, когда начиная с некоторой частоты (рис.20 линия П, точка 50) дальнейшее ее увеличение не приводит к пересечению с линиями одинакового уровня. Во всех остальных случаях, особенно для фазовых измерений, наблюдается заметное снижение метрологических требований с ростом частоты.

2. Уменьшение нижней граници диалазона измеряемых значений ρ и ε^* повышает требования к аппаратуре. Уменьшение ρ означает сдвиг прямых типа I, П вправо, уменьшение ε^* - сдвиг вниз. При этом заметно, что для амплитудных измерений уменьшение ε^* приводит к более резкому усилению требований к точности регистрации, чем уменьшение ε^* ; для фазовых измерений имеет место обратное.

3. Если считать, что параметры однородного пласта изменяются в диапазоне

10 0M·M ≤ P L 00

 $5 \leq \mathcal{E}^* \leq 80$,

то при частоте $f_{M} = 20$ МГц метровый зонд должен обладать чувствительностью 0,01 единиц прямого поля при амилитудных измерениях или порядка 0,02 радиана при фазовых.

Графики на рис.20 и 21 позволяют определять метрологические требования к зонду фиксированной дляны и с зафиксированной рабочей частотой. Но можно поставить задачу спределения необходимой частоты или длины зонда при известных метрологических возможностях регистрирующей аппаратуры. Эту задачу удобно решать с помощью рис.22,23. Здесь по оси абсимсе отложены значения $\rho \varepsilon^* f_M$, по оси ординат – величина $L_4 / \rho \sqrt{\varepsilon^*}$. Шифр кривых – уровень сигнала. Рыс.22 соответствует разностной амплитуде δh , рис.23 – разности фаз $\delta^4 \mathscr{G}$. По приведенным графи-

I4

кам удобно определять параметры зонда: длину и частоту, если известны парамстры среды и задана точность регистрации. Например, если среда имеет сопротивление $\beta = 10$ См.м, относительную диэлектрическую проницаемость $\varepsilon^* = 25$, то при чувствительности метрового зонда 0,02 единиц прямого поля (амплитудине измерения) необходима частота не менее 6 МПц для того, чтобн измерить диэлектрическую проницаемость среды. Та же минимальная частота получается в случае фазовых измерений, если предположить, что минимальный регистрируемый сигнал составляет 0,02 радиан. Как видно из графиков, увеличение длины зонда приводит к снижению минимальных необходимых частот, что обусловлено увеличением расстояния между точками регистрации величин, образующих разностную характеристку.

О возможностях интерпретации одновременно замеренных разностной амплитуды и сдвига фаз у трехэлементного зонда «Пу можно судить по рис.24. Представленная на этом рисунке палетка позволяет по показаниям зонда известной длины и работающего на известной частоте определять удельное сопротивление и диэлектрическую проницаемость пласта. Взяв на поле палетки точку с абсциссой δ^{h} и ординатой $\delta^{l} \varphi$, определяем по шифрам пересекающихся в этой точке кривых величины $L_{1fm}^{2} \epsilon^{x} = \mathscr{B}$ и $L_{1fm}^{2} / \rho = \chi$. Отсюда легко определить параметры среды:

$$\varepsilon^{*} = \frac{\varepsilon}{L_1^2 f_M^2}$$
$$\rho = \frac{L_1^2 f_M}{\varepsilon}$$

Значения разностной амплитуды и разности фаз получаются с некоторыми погрешностями, и поэтому на плоскости графика 24 следует наносить не точку ($d^{n}h$, $d^{n}\mathcal{S}$), а прямоугольник с центром в этой точке и сторонами, равными удвоенным абсолютным погрешностям. Тот факт, что кривые семейства $L_{1}^{e}f_{m}^{2}c^{*} = Const$, в отличие от кривых семейства $L_{1}^{e}f_{m}/\rho = Const$, расположены на всем поле палетки практически с равным шагом, свидетельствует о возможности более точного определения диэлектрической проницаемости среды по сравнению с ее удельным сопротивлением. С ростом удельного сопротивления кривые семейства $L_{1}^{e}f_{m}/\rho = Const^{e}$ -*Сопst* сливаются, что приводит к большим погрешностям в определении удельного сопротивления ρ .

§ 3. Пятиэлементный зонд ЧГФ в однородной среде

Пятиэлементные зонды с частотно-геометрической фокусировкой уже рассматривались в § I для иллюстрации высокой чувствительности метода ЧГФ к диэлектрической проницаемости среды. Там же приведены результаты расчетов разностных характеристик для пятиэлементных зондов ЧГФ с коэффициентом геометрического подобия $\ll = \sqrt{2}$ при $\frac{L_2}{L_1} = I.2$ (рис. IO-I5). В данном параграфе более детально проводится сравнение пятиэлементных зондов ЧГФ с зондами ДИК, исследуется влияние конструктивных параметров пятиэлементных зоңдов на измеряемые характеристики.

Исследование влияния коэффициента подобия \ll на величину сигнала пятиэлементной установки показывает, что так же как и в случае трехэлементного зонда, увеличение \ll ведет к возрастанию сигнала, но требование компактности установки ограничивает рост \ll . Как и в трехэлементном зонде, полагаем $\ll = \sqrt{2}$. Кроме величины \measuredangle , в пятиэлементных зондах появляется еще один конструктивный параметр – относительная база зонда $\mathscr{S} =$ $(\mathcal{L}_2 - \mathcal{L}_1)/\mathcal{L}_1$. На рис. 25-27 при фиксированном V = I приводятся значения Δh_1 , Δh_2 , $\Delta \mathscr{S}$ для различных значений \mathscr{E} . Шыфр кривых – $\beta_1 = \sqrt{\omega} \mathscr{A} \mathscr{E}/\mathcal{L}_1$. Ланные рисунков свидетельствуют о пропорциональном росте сигнала с ростом \mathscr{E} . Обычно база зондов метровой длины принимается равной 0,2-0,3 м. Для исследования была выбрана относительная база $\mathscr{E} = 0,2$.

Как показывают расчеты, иллюстрируемые рис. 10-12, величины Δh_1 , Δh_2 , $\Delta \mathscr{S}$ меняются в довольно широком диалезоне значений. Подобно тому, как это было сделано для трехэлементных зондов ЧГФ, на рис. 28-33 приводятся для пятиэлементных зондов ЧГФ графики, позволяющие для заданного диапазона параметров среды определять метрологические требования к измерительной аппаратуре (при известной длине самого короткого зонда L_1 и частоте генератора, рис. 28-30) или частоту колебаний и длину зонда при известном минимальном уровне регистрируемого сигнала (рис.31-33). Кроме того, на рис. 28-30 нанесены линии одинакового уровня чувствительности 5 (штрих-пунктир) и равного уровня сигнала 27 (пунктир) для трехалементного зонда ДИК с L2/L1 = I.2. Они определяют область значений / и 6*, которые при фиксированных частотах и размерах зонда могут быть определены данными ме-

I6

топами. Например. если допустить, что аппаратура ЛИК позволяет регистрировать величину сигнала не ниже 0.05 елиниц прямого поля для амплитупных или 0.05 радиан для фазовых измерений. и при этом потребовать. чтобы чувствительность к изменению ε^* была не ниже 0,5, то область допустимых для трехэлементного зонла ШК параметров будет лежать в секторе А - С. образованном на рис. 28-30 пересечением кривых € = 0.05 и 2 = 0.5. Эта odласть расширяется с повышением точности аппаратуры и понижением требованиям к разрешающей способности метода. При заланном минимальном удовне сигнала ? для пятиэлементных зоннов ЧГФ об-JACTED HADAMETDOB, XADARTEDNSYMMAX HOCTVILLE NCCAELOBAHND DAS-Desk. Gyner cobokymhoctb toyek, nexamix share nutur c mutoom \hat{c} . Например, для 2 = 0.05 это область В-С на рис. 28-30. Области попустимых параметров среды для зондов ДИК и ЧГФ не совпадают. Если из области допустимых параметров одного метода **WCRADUMT**L те точки, которые попалают в область допустимых параметров пругого метода (область С на рисунках), то оставшаяся часть будет областью параметров, где предпочтительно применение первого метола.

Как следует из расчетов чувствительности зонлов $\Psi \Gamma \Phi$ (рис. 13-15), величина 💈 во всем рассматриваемом диапазоне параметров не ниже 0,5, и поэтому при сравнении двух методов будем считать, что и зонды ДИК должны обладать чувствительностью / = 0,5. На рис. 28-30 в качестве примера заштрихованы области, прелпочтительные для каждого метода при 2 = 0.05. В области А предпочтительнее применение зондов ЛИК. в области В - применение зондов ЧТФ. Для каждой конкретной установки можно указать такое значение $\overline{\rho}$, что для $\rho < \overline{\rho}$ диапазон доступных измерению зондами ЧТФ значений диэлектрической проницаемости среды будет шире соответствующего диапазона для зондов ДИК, а для $Q > \overline{Q}$ - наоборот. Это значение соответствует на рис. 28-30 точке Q', которая является единственной общей точкой областей A и В. Например, если измеряется величина Δh_1 (рис. 28), то парапринимает, в зависимости от уровня 27, значения, метр /Р приведенные в табл. I. Например, при 2 = 0,05 зонд TT с L_{γ} = I м, работающий на частоте $f_M = 30$ МГц, предпочтительнее трехэлементного зонда ДИК в средах с Р ≤ 300 Ом.м.

Для сравнения методов ЧГФ и ЛИК при более низких значениях

Таблица I

Уровень 🤈	Ē
0,I	4
0,05	IO
0,02	25
0,0I	50
0,005	100

чувствительности зондов ДИК к изменению диэлектрической проницаемости среды (2 < 0,5) нужно в качестве критерия взять точность определения этими методами значения диэлектрической проницаемости пласта. Если при сопоставлении возможностей методов потребовать, чтобы оба

метода давали одинаковую относительную погрешность определения \mathcal{E}^* при одинаковой абсолютной погрешности измерений $\Delta f_q = \Delta f_q$, то из определения величины β (I.30) получается соотношение

$$\frac{\Delta f_1}{f_1 \chi_1} = \frac{\Delta f_2}{f_2 \chi_2} \quad \text{ILTE} \quad \int_1 \eta_1 = f_2 \chi_2$$

Следовательно, при различных значениях разрешающей способности двух методов уровень $\widetilde{c_1}$ зонда ДИК ниже по сравнению с уровнем $\widetilde{c_1} \frac{k_1}{k_2}$ зонда ЧГФ.

На рис. 28-30 нанесены те же две прямые, что и на рис. 20 м 21. Нетрудно видеть, что разностные характеристики Δh_1 и ΔS предпочтительны по сравнению с характеристикой Δh_2 . При измерении величин Δh_1 и ΔS , как и в случае трехэлементных зондов ЧГФ, требования к чувствительности ашпаратуры снижаются с увеличением частоты и усиливаются при уменьшении нижней границы диапазона измеряемых значений \mathcal{E}^* и \mathcal{P} . В целом сигналы в пятиэлементных установках ЧГФ ниже, чем в трехэлементных зондах. Например, при $L_1 = I \, \text{м}$, $f_{\mathcal{M}} = 50 \, \text{МГц}$ при исследовании пластов с диапазоном параметров $5 \leq \mathcal{E}^* \leq 80$, $10 \leq \mathcal{C}^{<\infty}$ в случае пятизлементного зонда требуется обеспечить возможность регистрации, по крайней мере, 0,0I единиц относительной амплитуды, а фазомер должен обладать точностью не менее чем в 0,02 радиана.

Определение частоти и длины зонда при известном минимальном уровне сигнала по графикам на рис.3I-33 производится так же, как и для трехалементных зондов. Например, если зонд с $\mathcal{L}_{f} =$ I м способен регистрировать сигнал величины 0,005 и более относительной амплитуды, то для работы в пластах с 5 $\leq \mathcal{E}^{*} \leq 80$, $\varsigma \geq 10$ Ом.м должно быть $f_{M} \geq 25$ МГц (рис.3I),а для фазометра с пороговой чувствительностью 0,05 радиана $f_{M} \geq 70$ МГц (рис. 33). Зонд ЧГФ обладает высокой чувствительностью к диэлектрической проницаемости среды, и если его применять в комплексе с обычным трехэлементным зондом ДИК, то можно проводить уверенную интерпретацию с целью одновременного определения ρ и ε^* пласта. На рис.34-36 приводятся палетки, позволяющие определять ρ и ε^* , если известны частота и длина установки и значения измеряемых характеристик для трехэлементного зонда ДИК и пятиэлементного зонда ЧГФ. Точность интерпретации по таким палеткам зависит от угла, под которым пересекаются кривые на графиках. С этой точки зрения, наиболее благоприятны фазовые измерения, из амплитудных измерений пара Δh_1 , dh_1 может быть более точно проинтерпретирована по сравнению с Δh_2 и dh_2 .

§ 4. Радиальные характеристики зондов с частотно-геометрической фокусировкой

Для анализа влияния скважины и зоны проникновения были проведены расчеты характеристик зондов ЧГФ в двухслойной и трехслойной цилиндрически-слоистых моделях. Во всех случаях радиус скважины полагался равным 0, I м, ул тьное сопротивление скважины f_c = I 0м.м, относительная диэлектрическая проницаемость в скважине $\mathcal{E}_c^{*} = 80.$

Рассмотрим на основе полученных результатов чувствительность измеряемых величин к диэлектрической проницаемости пласта, а также оценим соотношение между результатами измерений в скважине и данными аналогичных измерений в однородной среде. Сначала исследуем трехэлементные зонды ЧГФ в модели "скважина-пласт" бесконечной мощности" и сравним их с трехэлементными зондами ДИК.

Расчеты проводились на частоте $f_7 = 30$ МГц. Рассматривалось 4 зонда:

Зонды ДИК (🗲 = 30 МГц) 30HTH TTO (4 = 30 MTU. f 2 = 15 MTn) $L_2 = IM;$ $L_1 = 0.8M, L_2 = 0.8\sqrt{2M}$ I) $L_1 = 0.8 \text{ M}$, $L_{2} = I_{4} M_{3}$ $L_1 = I_1 2 M$, $L_2 = I_2 \sqrt{2}M$ 2) $L_{y} = I_{,2} M_{,2}$ $L_1 = I_{,6} M, L_2 = I_{,6} \sqrt{2} M.$ 3) $L_1 = I_1 6 M_1$ $L_{2} = I, 8 M;$ $L_1 = 2.0 \text{ M}, L_2 = 2.0 \text{ / } 2\text{M}.$ $L_1 = 2.0 \text{ M}.$ $L_2 = 2.2 \text{ M};$ 4) Как уже отмечалось, трехэлементные зонды ДИК обладают фокусирую-

шими свойствами. что позволяет ослабить влияние скважины. Фазовые измерения трехолементным зондом ЧГФ этим свойством уже не обладают, так как из-за разных частот, на которых работают зонды ПФ, аддятивная фазовая помеха, связанная с произведением волнового числа скважини на ее радиус, не может быть исключена. На рис. 37-38 приводятся графики фазовых измерений зондами ЛИК и ЧГФ при $L_{f} = 0.8$ м. По оси абсцисс отложены значения диэлектрической проницаемости пласта, шифр кривых - удельное coпротивление пласта. Как следует из анализа рисунков при $P_0 \ge 16$ зонды ШК обладают большей чувствительностью к изменению пиэлектрической проницаемости среды по сравнению с зондами Ψ**Γ**Φ. данные которых к тому же слабо пифференцированы по Ра Аналогичные результаты имеют место и для зондов с другими значениями /. что свидетельствует о нецелесообразности фазовых измерений трехэлементными зондами ЧГФ.

Более эффективным параметром является разностная амплитупа трехэлементных зондов ЧТФ. что иллюстрируется рис. 39-42. Из графиков видно, что трехалементный зонд ПФ более чувствителен к изменению параметров пласта по сравнению с трехалементным зондом ШК. Особенно это заметно для низких значений Ра и Ел. Кривне ЧТФ лучше дифференцированы по значениям удельного coпротивления пласта. Чувствительность к диалектрической проницаемости пласта с увеличением длины трехэлементного зонда ПФ почти не изменяется при больших удельных сопротивлениях пласта и возрастает в пластах с пониженным удельным сопротивлением (рис. 40, 42). Величина измеряемого сигнала с увеличением длинн зонда возрастает в высокоомных пластах ($\rho_0 > 32$ Ом.м) и уменьmaerca B Huskoomhux ($P_{a} \angle 32$ Om.m).

В таблице П для трехэлементных зондов различной длины привелены отношения величины d^h в молели "скважина-пласт" к зна-YCHIMAN Sh тех же зондов в однородной среде с параметрами пласта. Частота 👍 = 30 МГц. Из таблицы следует, что показания практически всех зондов в пластах с $\rho_n \mathcal{E}_n^* > 40$ не более чем на 20% отличаются от показаний в однородной среде.

Сопоставим теперь возможности трехалементных зондов ДИК и пятиэлементных зондов ПФ. Расчеты, проведенные в двухслойной среде на частотах $f_4 = I$, IO, 30 МГц для трехалементных зондов ДИК I) - 4) и их пятиэлементных аналогов ЧГФ показали следущее:

Таблица П

$\overline{\ }$	PEX	2,5	5	10	20	40	80
	2	7,125	3,962	2,375	I,572	I,I52	0,9052
0,8	4	3,026	I,946	I,402	I,I20	0,9578	0,8326
	8	I,467	I,I86	I,04I	0,9572	0,89I3	0,8019
	I6	0,9922	0,9407	0,9297	0,9119	0,872I	0,7762
	32	0,8076	0,8765	0,9049	0,9033	0,8608	0,7412
	64	0,7856	0,8706	0,9049	0,9007	0,8460	0,7034
	I28	0,7992	0,8790	0,9077	0,8960	0,8308	0,6729
	256	0,8179	0,8864	0,9079	0,8907	0,8192	0,6529
	512	0,8312	0,8897	0,9066	0,8866	0,8119	0,64I3
	2	5,54I	3,184	2,029	I,444	I,I3I	0,9344
	4	2,553	I,737	I,324	I,I07	0,9788	0,87II
	8	I,396	I,I68	I,049	0,9792	0,9214	0,8403
	16	I,009	0,9805	0,96I3	0,940I	0,9014	0,8I43
1,2	32	0,897I	0,9289	0,9391	0,9297	0,8878	0,7790
	· 64	0,8768	0,92I3	0,936I	0,9242	0,8707	0,7381
	I28	0,8836	0,9249	0,9355	0,9I69	0,8523	0,7023
	256	0,8947	0,928I	0,933I	0,9092	0,8375	0,6772
	512	0,9021	0,9285	0,9301	0,9034	0,8278	0,6621
	2	4,425	I,666	1,459	I,257	I,II4	0,9494
	4	2,299	I,624	I,278	I,093	0,9858	0,8892
	8	I,327	I,I42	I,042	0,9864	0,9346	0,8580
	16	I,022	0,9926	0,9729	0,9518	0,9I47	0,8336
Ι,6	32	0,9317	0,9496	0,9530	0,94I0	0,9005	0,7994
	64	0,9I37	0,9418	0,9487	0,934I	0,8823	0,7573
	I28	0,9175	0,943I	0,9464	0,9252	0,8619	0,7178
	256	0,9247	0,944I	0,9424	0,9I59	0,8445	0,6885
	512	0,9291	0,9429	0,938I	0,9084	0,8326	0,6702

I. Чувствительность к диэлектрической проницаемости пласта у пятиэлементных зондов ЧГФ существенно выше, чем у трехэлементных зондов ДИК. Это имеет место как для амплитудных, так и для фазовых характеристик. В качестве примера на рис.43-46 приводятся результаты расчетов для зондов с $L_1 = 0.8$ м. 2. Фокусирующие свойства иятиэлементного зонда ЧГФ обеспечиваются хорошими фокусирующими свойствами трехэлементных зондов ДИК. Рассмотрим отношения $\rho_{\kappa h}$ и $\rho_{\kappa \varphi}$ величин Δh_1 и $\Delta \varphi$ в модели "скважина-пласт" к значениям Δh_1 и $\Delta \varphi$ в пласте без скважины (табл.Ш). В таблице приведены значения $\rho_{\kappa h}$ и $\rho_{\kappa \varphi}$ для зондов с $L_1 = 0.8$ м, I,2 м, I,6 м, на частоте $f_1 = 30$ МГц. Кроме того, для зонда с $L_1 = I,6$ м приведены величины $\rho_{\kappa h}$ и

 $\rho_{\kappa \varphi}$ на частоте f_{i} = IO МГц. Анализ таблицы позволяет отметить следующие закономерности:

- увеличение частоты улучшает фокусирующие свойства зондов ЧГФ;

- влияние скважины ослабевает при увеличении отношения ρ_n/ρ_c и уменьшении отношения $\varepsilon_n^*/\varepsilon_c^*$;

- на частоте 30 МГц в пластах с $\mathcal{E}^* \ge 10$ для любых значений удельного сопротивления пласта, начиная с I Ом.м и выше, значения Δh_1 в скважине отличаются от значений в однородной среде не более чем на 20%;

- удлинение зонда несколько улучшает его фокусирующие свойства.

3. В отличие от трехэлементных зондов ДИК, у пятиэлементных зондов ЧПФ с ростом удельного сопротивления пласта ρ_{Π} уровень сигналов растет. Это обстоятельство является предпосылкой для комплексирования измерений трехэлементным зондом ДИК и пятиэлементным зондом ЧПФ с целью одновременного определения ρ_{Π} и \mathcal{E}_{n}^{*} . Действительно, пусть $dh_{1} = \alpha$, $\Delta h_{1} = \beta$. Тогда множество пар ($\rho_{\Pi}, \mathcal{E}_{n}^{*}$), для которых $dh_{1} = \alpha$, таково, что с ростом \mathcal{E}_{n}^{*} растет и ρ_{Π} , а множество пар ($\rho_{\Pi}, \mathcal{E}_{n}^{*}$), для которых $\Delta h_{1} = \beta$, обладает противоположным свойством – с ростом \mathcal{E}_{n}^{*} величина ρ_{Π} падает.

Для изучения глубинности метода частотно-геометрической фокусировки проводились расчеты в трехслойной модели "скважина-зона проникновения-пласт бесконечной мощности". Радиус зоны проникновения полагался равным 0,2; 0,3; 0,4 м. Диэлектрическая проницаемость зоны проникновения была фиксированной: $\mathcal{E}_{3\Pi} = 20$. Удельное сопротивление зоны проникновения ($\mathcal{P}_{3\Pi}$) предполагалось равным 8 Ом.м или 64 Ом.м. Анализ полученных результатов приводит к следующим выводам:

I. Для всех исследуемых пятиэлементных зондов ЧТФ наблюда-

Таблица Ш

			e e*	2,5	5	7,5	IO	15	20	30	40	60	80
T			2	-0,0556	0,4603	0,6365	0,7343	0,8181	0,8529	0,906I	0,9360	0,9533	0,9683
			4	-0,503I	0,2543	0,5036	0,6315	0,7578	0,8206	0,8838	0,9152	0,946I	0,96II
			8	-0,3937	0,3I9I	0,5555	0,6740	0,7909	0,8490	0,9059	0,9336	0,9599	0,9722
			16	-0,1520	0,4547	0,6542	0,7526	0,8486	0,8946	0,938I	0,9580	0,9758	0,9835
1	3	PKn	32	0,II3I	0,6045	0,7612	0,8360	0,9056	0,9370	0,9648	0,9765	0,9862	0,9901
	WO		64	0,3617	0,7412	0,8536	0,9039	0,9476	0,9659	0,9808	0,9865	0,9910	0,9927
	1		I28	0,5777	0,848I	0,9192	0,9485	0,972I	0,98II	0,9879	0,9905	0,9925	0,9934
N	47		256	0,7492	0,9191	0,9577	0,9723	0,983I	0,9872	0,9903	0,9917	0,9929	0,9935
ω			512	0,8675	0,9578	0,9755	0,9819	0,9870	0,989I	0,9909	0,9919	0,9929	0,9935
			2	0,1593	0,5708	0,7I04	0,7884	0,8589	0,8833	0,9252	0,9486	0,9625	0,9743
	X		4	0,0614	0,5520	0,6864	0,7661	0,8445	0,8837	0,9233	0,9430	0,9625	0,9722
	1.6		8	0,2757	0,6398	0,7609	0,8217	0,8822	0,9125	0,9426	0,9577	0,9725	0,9798
	11		16	-0,472I	0,7390	0,8277	0,8720	0,9I64	0,9384	0,9602	0,9710	0,98I4	0,9863
	4	Pry	32	0,6I39	0,8112	0,8767	0,9094	0,9417	0,9577	0,9732	0,9806	0,9874	0,9904
			64	0,7087	0,8605	0,9I06	0,9354	0,9594	0,9709	0,9816	0,9864	0,9906	0,9924
			I28	0,7708	0,8943	0,9342	0,9553	0,97II	0,9792	0,9863	0,9893	0,9920	0,993I
			256	0,8I28	0,9183	0,9504	0,9650	0,9780	0,9836	0,9885	0,9906	0,9925	0,9934
			512	0,8438	0,9352	0,9607	0,9718	0,9814	0,9825	0,9894	0,99II	0,9928	0,9936

Таблица Ш (продолжение I)

		e*	2,5	5	7,5	IO	15	20	30	40	60	80
	1	6	2,355	I,53I	I,778	I,I99	3,000	I,0I5	I,647	I,002	0,9957	0,9927
		4	0,3590	0,6803	0,7328	0,8459	0,8691	0,9254	0,9545	0,9675	0,9803	0,9864
		8	0,3722	0,6990	0,8I37	0,8596	0,9I42	0,937I	0,9615	0,9729	0,9834	0,988I
	0.	16	0,4662	0,1592	0,8521	0,8973	0,9389	0,9578	0,9744	0,9815	0,9874	0,990I
	ГКП	32	0,6190	0,844I	0,9099	0,9290	0,9642	0,9746	0,9829	0,9862	0,989I	0,9906
1		64	0,7686	0,9I42	0,95I3	0,9663	0,978I	0,9826	0,9861	0,9876	0,9892	0,9904
'z		I28	0,8775	0,9550	0,9720	0,9784	0,983I	0,9856	0,9867	0,9877	0,9890	0,9902
WI		256	0,9384	0,9727	0,9796	0,9822	0,9843	0,9854	0,9866	0,9875	0,9888	0,9900
30		512	0,9647	0,9785	0,9816	0,9830	0,9844	0,9853	0,9865	0,9873	0,9886	0,9888
11		2	3,765	2,088	2,291	I,384	3,928	I,076	I,076	I,OII	0,9919	0,9860
A		4	0,4442	0,7189	0,7675	0,8616	0,8803	0,9307	0,9564	0,9680	0,9792	0,9846
		8	0,568I	0,7842	0,8643	0,8598	0,9335	0,9494	0,9668	0,9753	0,9833	0,9869
S	Pry	16	0,693I	0,8506	0,9019	0,9282	0,9533	0,9556	0,9770	0,982I	0,9867	0,9887
1,6		32	0,7936	0,9014	0,9363	0,9533	0,9693	0,9765	0,9830	0,9857	0,988I	0,9892
		64	0,8629	0,9361	0,9587	0,9690	0,9782	0,9821	0,9855	0,9870	0,9884	0,9893
7	1	I28	0,9088	0,9574	0,9712	0,9770	0,9820	0,9842	0,9862	0,9873	0,9884	0,9892
		256	0,9377	0,9688	0,9768	0,9803	0,9834	0,9849	0,9864	0,9873	0,9884	0,9892
		512	0,9537	0,9737	0,9790	0,98I5	0,9838	0,985I	0,9865	0,9873	0,9883	0,989I

Таблица Ш (продолжение 2)

		8	2,5	5	7,5	10	15	20	30	40	60	80
		2	0,6199	0,8062	0,8626	0,9077	0,9761	0,9634	0,9737	0,9818	0,9893	0,9955
		4	0,5886	0,6269	0,746I	0,8I89	0,8788	0,9I44	0,946I	0,9617	0,9774	0,9851
		8	0,1544	0,5940	0,7406	0,8116	0,8827	0,9I69	0,9499	0,9654	0,9797	0,9863
1		I6	0,2366	0,6553	0,7898	0,8537	0,9I39	0,9412	0,9654	0,9757	0,9846	0,9886
	Irh	32	0,4205	0,7637	0,8648	0,9037	0,9484	0,9643	0,9829	0,9822	0,9868	0,9893
		64	0,6289	0,8651	0,9256	0,9499	0,9689	0,9761	0,9818	0,9842	0,9902	0,989I
		I28	0,7966	0,9295	0,9583	0,9689	0,9768	0,9799	0,9828	0,9844	0,9868	0,9888
Z		256	0,8955	0,9663	0,9707	0,9743	0,9789	0,9808	0,9827	0,9847	0,9866	0,9886
30 M		512	0,9664	0,9707	0,9743	0,9767	0,9791	0,98II	0,9825	0,9846	0,9865	0,9885
H		2	0,4869	0,7356	0,8115	0,8718	0,9736	0,9469	0,9601	0,9703	0,9800	0,9876
H		4	0,6689	0,6684	0,7793	0,8360	0,8880	0,9193	0,9470	0,0906	0,9742	0,9807
1		8	0,4274	0,7170	0,8I44	0,8615	0,9097	0,933I	0,9563	0,9675	0,9781	0,9830
		16	0,5618	0,7864	0,8605	0,8976	0,9338	0,95II	0,9676	0,9751	0,9818	0,9848
2	PKY	32	0,6826	0,8490	0,903I	0,9293	0,9540	0,9653	0,9830	0,9796	0,9837	0,9852
		64	0,7745	0,896I	0,9339	0,9512	0,9666	0,9732	0,9788	0,9813	0,9796	0,9852
7		I28	0,8402	0,9279	0,9526	0,9633	0,9725	0,9764	0,9800	0,9818	0,9837	0,9850
ł		256	0,8861	0,9492	0,9619	0,9678	0,9747	0,9775	0,9803	0,9818	0,9836	0,9848
ł.		512	0,9150	0,9586	0,9658	0,9706	0,9755	0,9776	0,9804	0,9818	0,9835	0,9847

Таблица II (продолжение 3)

I			e e*	2,5	5	7,5	10	15	20	30	40	60	80
Τ	1		2	I,208	I,I06	I,073	I,056	I,037	I,03I	I,023	I,020	I,0I6	I,0I5
			4	0,5886	0,7964	0,8667	0,9008	0,9362	0,9537	0,9720	0,9815	0,9917	0,9973
			8	0,1531	0,5917	0,7375	0,8098	0,8817	0,9170	0,9516	0,9883	0,9844	0,9923
			16	0,0295	0,5604	0,7317	0,8I42	0,8924	0,9284	0,9608	0,9683	0,9874	0,9933
		Put	32	0,1419	0,65I4	0,8030	0,8710	0,9300	0,9545	0,9743	0,9749	0,9897	0,9940
	2	/ Kn	64	0,3822	0,7817	0,8848	0,9264	0,9588	0,97II	0,9808	0,9823	0,9902	0 ,994I
	202		I28	0,634I	0,8835	0,9370	0,9565	0,9712	0,9770	0,9824	0,965I	0,990I	0,9939
2	" "		256	0,8I52	0,9354	0,9584	0,9672	0,9747	0,9783	0,9825	0,9853	0,9899	0,9938
1	£,	1.3	512	0,9049	0,9534	0,9647	0,9700	0,9753	0,9784	0,9823	0,9852	0,9897	0,9936
			2	0,9638	0,9810	0,9876	0,9894	0,9895	0,9942	0,9962	0,9971	0,9984	0,9994
			4	0,6689	0,8323	0,8877	0,9I42	0,9420	0,8555	0,9695	0,9776	0,9839	0,9877
			8	0,4512	0,7273	0,8I94	0,8652	0,9III	0,9339	0,9563	0,9676	0,9783	0,9834
			16	0,4390	0,7263	0,8217	0,8690	0,9I56	0,9383	0,9599	0,9699	0,9788	0,9828
	8	S	32	0,5II5	0,7687	0,8527	0,8936	0,9326	0,9506	0,9753	0,9735	0,9796	0,9825
	= 0	144	64	0,5991	0,8185	0,8871	0,9I90	0,9476	0,9600	0,9706	0,9752	0,9796	0,9820
	44		I28	0,6785	0,8609	0,9I34	0,9364	0,9526	0,9647	0,9722	0,9757	0,9794	0,98I6
			256	0,7435	C 8896	0,9286	0,9454	0,960I	0,9666	0,9727	0,9757	0,9792	0,98I4
			512	0,7895	0,9053	0,9360	0,9495	0,9617	0,9673	0,9728	0,9757	0,9790	0,9812

ется монотонный рост сигнала при увеличении диалектрической проницаемости пласта. При повышающем проникновении кривые Δh_1 и $\Delta \mathscr{G}$ проходят через ноль. Характерное для всех моделей среды и различных зондов поведение графиков измеряемых величин иллострируют рис.47-54. На них изображены результати расчетов для зонда с $L_1 = I,6$ м при радиусе зоны проникновения $\mathcal{Q}_{3n} = 0,3$ м. Рис.47-50 соответствуют значению $\beta_{3n} = 8$ Ом.м, рис.5I-54 – значению $\beta_{3n} = 64$ Ом.м. По оси абсцисс отложены значения относительной диэлектрической проницаемости пласта \mathcal{E}_n^* . Шифр кривых –

Ра. На графиках можно наблюдать, что с ростом удельного сопротивления пласта смена знака у измеряемых зондами ЧГФ величин происходит при все меньших значениях диэлектрической проницаемости пласта.

2. Во всех исследованных моделях пятиэлементные зонды ЧТФ обладают более высокой чувствительностью к изменению диэлектрической проницаемости пласта по сравнению с трехэлементными зондами ДИК. Это свидетельствует одновременно и о большей глубинности метода ЧТФ.

§ 5. Вертикальные характеристики зондов ЧГФ

Как было показано в предыдущем параграфе, пятиэлементные зонды ЧФ обладают повышенной глубинностью исследования в радиальном направлении. Другой важной характеристикой метода является локальность исследования в вертикальном направлении. Понятие локальности связано с влиянием горизонтальных границ на результаты измерений: из двух методов более локальным принято считать тот, у которого влияние горизонтальных границ начинает сказываться при меньшем их удалении от элементов зонда.

В качестве основной модели для исследования вертикальных характеристик традиционно используется пласт конечной мощности

Н , расположенный в однородной среде. Были проведены расчеты кривых профилирования пятиалементными зондами ЧГФ в различных моделях. В качестве примера на рис.55-60 приведены кривне профилирования для трех измеряемых характеристик пятиалементного зонда ЧГФ в моделях, изображенных на рис.61. Мощность пласта полагалась равной 4 м. Пятиэлементный зонд имеет параметры ∠₁ =

0,8 м, $L_2 = 1,0$ м, $\alpha = \sqrt{2}$, $r_f = 30$ МГп. У всех измеряемых характеристик наблюдается два экстремума, расстояние между которыми равно мощности пласта. При этом экстремумы на кривых профилирования соответствуют таким положениям зонда, при которых центр измерительной базы расположен против границы пласта. Отсюда следует, что точкой записи зонда целесообразно считать центр базы, расположенный на расстоянии ($L_7 + L_4$)/2 от источника поля.

Большая мощность пласта в рассматриваемом примере обеспечивает уверенный выход измеряемых характеристик на значения, соответствующие однородной среде с параметрами пласта. Взаимодействие границ практически отсутствует: в окрестности каждой границы кривые профилирования имеют такую же форму, как в среде с двумя полупространствами (ср. кривне профилирования в окрестностях экстремельных значений одного знака на рис. 55 и 58. 56 и 59. 57 и 60). Четко фиксируртся границы на кривых профилирования и в случае, когда мощность пласта сравнима с длиной зонда. В качестве примера на рис.62 и 63 приводятся кривые профилирования IЛЯ H-= I,4 м. В целом анализ расчетов показывает, что если MOIL ность пласта превосходит длину измерительной базы зонда, то на кривых профилирования имеются экстремумы, отмечающие положение границ.

В случае, когда центр измерительной бази зонда располагается в центре пласта, измеряемые параметры, как это следует из рис.62,63, имеют значения, близкие к значениям в однородной среде. Это свидетельствует о том, что при интерпретации данных, полученных в процессе вертикального профилирования зондами ЧГФ следует использовать значения измеряемых характеристик, соответствующие центральному (относительно пласта) положению измерительной базы.

ЛИТЕРАТУРА

I. ДАЕВ Д.С. Высокочастотные электромагнитные методы исследования скважин. М., "Недра", 1974, 190 с.



Рис. 1.











































Рис.21





Puc.23



Рис.24







РИС. 29

Puc. 30









РИС. 34











Рис.38















PHC. 44







PUC. 51





